

# 第4回 総会 第8回 オープンセミナー

日時： 令和8年 **5**月 **12**日(火)

総会 **14:30~** (受付14:00~)

セミナー **15:30~**

会場： **熊本城ホール 大会議室**



## ◆ お申し込み

下記のリンクまたはQRコードよりお申し込みください  
[4月27日(月)までのお申込みをお願いいたします]

<https://forms.gle/JPAPm9tu6nWooTjEA>

お申し込みはこちらから



- ◆ 総会
  1. 開会挨拶
  2. 議決事項
  3. 報告事項

## ◆ オープンセミナー

「先端電子顕微鏡法による電子デバイス解析」

熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構 教授

佐藤 幸生



透過型電子顕微鏡法(TEM: Transmission Electron Microscopy)は、原子のスケールで物質の構造を可視化することができるため、先端の材料・デバイス等の研究開発には欠かせません。

我々はその中で、①ピコメートル(1ピコメートルは1/1000ナノメートル)のレベルで原子位置を精密に決定できる技術や②電子顕微鏡の中でデバイスに電圧を加えてデバイス動作時の応答を直接見る「その場」技術を得意としています。

講演では、これらの技術を用いた電子デバイスの研究例について紹介します。

これらの技術は、単なる形状の観察に留まらず、界面の歪みや結晶欠陥がデバイス特性に与える影響を動的に解析することを可能にします。最先端半導体のプロセス開発や故障解析に携わる技術者・研究者に限らず、半導体の様々な分野に関わる皆様にとって、新たな知見を得るヒントとなれば幸いです。